

Перестраиваемые объемные акустические резонаторы с индуцированным пьезоэффеktом в сегнетоэлектрике

© И.Б. Вендиk

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ),
Санкт-Петербург, Россия

E-mail: IBVendik@eltech.ru

Разработана электромеханическая модель наведенного пьезоэффекта в акустическом резонаторе на пленке сегнетоэлектрика в присутствии постоянного и слабого переменного напряжений. Основным уравнением является разложение свободной энергии в ряд по электрической индукции и механической деформации. Система электромеханических уравнений для переменных компонент индукции и механической деформации включает все линейные члены, а также компоненту электрострикции, нелинейную по отношению к механической деформации.

Полученные электромеханические уравнения позволили получить в одномерном приближении эффективные параметры материала — пьезомодуль и модуль упругости — в виде функций напряженности постоянного электрического поля, приложенного к акустическому слою. Найдены выражения для управляемого электромеханического коэффициента связи, а также резонансных частот перестраиваемого акустического резонатора. Показано, что наиболее существенным параметром, ответственным за перестройку, является нелинейный коэффициент электрострикции M , оценка величины и знака которого выполнена на основе имеющихся экспериментальных данных.

Работа выполнена в рамках проекта „Nanostar“ 6-й Рамочной программы Европейской комиссии (проект № 016340).

PACS: 77.65.-j, 77.65.Bn

1. Введение

В последние годы проявляется повышенный интерес к тонкопленочным СВЧ-устройствам на объемных акустических волнах. Резонаторы на объемных акустических волнах (ОАР) выполняются на материалах с высоким значением пьезоэлектрического модуля и большой акустической добротностью. Применение в качестве акустического слоя материала с электрически управляемыми акустическими параметрами позволило бы расширить функциональные возможности устройств на ОАР. В связи с этим возникла проблема изучения электромеханических свойств сегнетоэлектрических материалов, используемых в качестве акустического слоя электрически перестраиваемых ОАР.

В сегнетоэлектрических материалах с центросимметричной кубической структурой в парафазе пьезоэлектрический эффект не должен наблюдаться. Однако в реальных образцах (SrTiO_3 и $\text{Ba}_x\text{Sr}_{1-x}\text{TiO}_3$ выше температуры Кюри), в которых присутствуют механические напряжения, обнаруживается слабый пьезоэффект. Механический отклик на слабый СВЧ-сигнал может быть усилен за счет электрострикционного эффекта в присутствии постоянного электрического поля. Впервые результаты перестройки акустического резонатора за счет наведенного пьезоэффекта были опубликованы в 1948 г. в [1]. Резонатор в виде диска был выполнен из керамики BaTiO_3 . Наблюданное изменение резонансных частот в условиях резонанса и антирезонанса [2] при комнатной температуре на частотах 0.1–0.4 kHz объяснялось вкладом электрострикции в присутствии большого постоянного

поля смещения. Дальнейшие экспериментальные исследования выполнялись на пленках сегнетоэлектрических материалов при температурах выше фазового перехода. Так, в [3] были приведены результаты измерения частотной зависимости потерь в планарном конденсаторе на пленках $\text{Ba}_x\text{Sr}_{1-x}\text{TiO}_3$ с характерными резонансными пиками. Наличие пиков было объяснено в [4] вкладом электрострикции в наведенный пьезоэффект и генерацией акустических колебаний в зазоре конденсатора. Электрострикционный резонанс наблюдался в плоско-параллельном конденсаторе на пленке $\text{Ba}_{0.7}\text{Sr}_{0.3}\text{TiO}_3$ на образцах разной толщины (100–250 nm) [5]: при приложении постоянного электрического поля наблюдался резонансный отклик на частотной зависимости емкости и $\text{tg } \delta$. Резонансная частота для образцов разной толщины менялась обратно пропорционально толщине BSTO-пленки, что свидетельствовало о возбуждении акустических колебаний вдоль толщины пленки. Серия экспериментальных работ по исследованию акустического резонанса в условиях наведенного пьезоэффекта была выполнена на эпитаксиальных пленках BSTO и BaTiO_3 в структуре плоского конденсатора, из которых упомянем [6] и [7]. Исследовался резонансный отклик потерь в конденсаторе, а также резонансный характер частотной зависимости входного импеданса исследуемой структуры. Под действием постоянного электрического поля резонансная частота ОАР на BSTO уменьшалась, а для ОАР на титанате бария увеличивалась.

Была предложена модель описания свойств сегнетоэлектрика с наведенным пьезоэффектом [8], в соответствии с которой резонансная частота смещалась в об-

ласть более высоких частот под действием постоянного электрического поля. В этой модели использовались линейные электромеханические уравнения. Введение в модель нелинейного электрострикционного эффекта [9] позволило адекватно описать поведение ОАР в присутствии управляющего поля, используя нелинейный коэффициент электрострикции в качестве подгоночного параметра.

В настоящей работе излагаются основные представления модели и обсуждается ее достоверность.

2. Электромеханические уравнения в условиях наведенного пьезоэффекта

Вывод электромеханических уравнений базируется на представлении свободной энергии в виде разложения в ряд по степеням поляризации [10] или электрической индукции [9]. В физической акустике принято электромеханические уравнения записывать относительно индукции, поэтому удобно исходные уравнения записывать также в функции от индукции. Поскольку поляризация \mathbf{P} и индукция \mathbf{D} связаны соотношением

$$\mathbf{D} = \varepsilon_b \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad (1)$$

где \mathbf{E} — напряженность электрического поля, ε_b — диэлектрическая проницаемость несегнетоэлектрической части образца, в случае сегнетоэлектрика вкладом несегнетоэлектрической части в индукцию можно пренебречь и принять $\mathbf{D} = \mathbf{P}$. Тогда выражение для свободной энергии можно представить в виде

$$\begin{aligned} F(u_{ij}, D_m) = & F_0 + \frac{1}{2} \chi_{mn}^{-1} D_m D_n + \xi_{mnkl} D_m D_n D_k D_l \\ & - h_{ijm} u_{ij} D_m + \frac{1}{2} c_{ijkl} u_{ij} u_{kl} + \frac{1}{2} G_{ijmn} c_{ij} D_m D_n \\ & + \frac{1}{2} M_{ijklmn} u_{ij} u_{kl} D_m D_n + \frac{1}{2} N_{ijklmn} u_{ij} D_k D_l D_m D_n + \dots, \end{aligned} \quad (2)$$

где $D_{m(nkl)}$ — компоненты тензора электрической индукции, u_{ij} — компоненты тензора механической деформации, $\chi_{mn}^{-1} = \varepsilon_0^{-1} \varepsilon_{r,mn}^{-1}$ — компоненты тензора обратной диэлектрической проницаемости, ξ_{klmn} — компоненты тензора диэлектрической нелинейности по отношению к электрическому полю, h_{ijm} — компоненты пьезоэлектрического модуля, c_{ijkl} — компоненты тензора модуля упругости, G_{ijmn} — компоненты тензора электрострикции, M_{ijklmn} — компоненты тензора электрострикции, нелинейной по отношению к механической деформации, N_{ijklmn} — компоненты тензора электрострикции, нелинейной по отношению к квадрату электрической индукции. При дальнейшем рассмотрении пренебрежем вкладом параметров ξ_{klmn} и N_{ijklmn} .

Дифференцируя (2) по D и u , получим соответствующие уравнения для напряженности электрического поля E_m и механического напряжения σ_{ij} . При приложении

электрического напряжения к электродам ОАР в виде тонкопленочного плоскопараллельного конденсатора можно рассматривать задачу в одномерном приближении, предполагая наличие только одной компоненты всех электрических и механических составляющих в направлении, перпендикулярном плоскости электродов. Представим все компоненты в виде суммы постоянной (dc) и переменной (ac) составляющих и, линеаризуя отклик по малой переменной компоненте, запишем электромеханические уравнения для переменного механического напряжения и переменного электрического поля в скалярном виде

$$\sigma^{(ac)} = c u^{(ac)} - h D^{(ac)} + 2 G D^{(ac)} D^{(dc)} + M D^{(dc)} u^{(ac)}, \quad (3)$$

$$E^{(ac)} = -h u^{(ac)} + \varepsilon_0^{-1} \varepsilon_r^{-1} D^{(ac)} + 2 G D^{(dc)} u^{(ac)}. \quad (4)$$

Следует отметить, что в уравнениях (3) и (4) существует член, учитывающий пьезоэффект. Слабый пьезоэлектрический эффект в сегнетоэлектрике в парафазе объясняется наличием механических напряжений и деформаций в кристаллической решетке [11]. В присутствии постоянного электрического поля, приложенного перпендикулярно толщине пленки, возникает наведенный пьезоэффект, и интенсивно возбуждаются объемные акустические волны.

Уравнения (3) и (4) могут быть представлены в виде, принятом в классической акустике [2]

$$\sigma^{(ac)} = \tilde{c}(E^{(dc)}) u^{(ac)} - h^*(E^{(dc)}) D^{(ac)}, \quad (5)$$

$$E^{(ac)} = -h^*(E^{(dc)}) u^{(ac)} + \varepsilon_0^{-1} \varepsilon_r^{-1} (E^{(dc)}) D^{(ac)}, \quad (6)$$

где введены новые эффективные параметры: пьезомодуль $h^*(E^{dc})$ и модуль упругости $\tilde{c}(E^{dc})$, зависящие от напряженности поля смещения

$$h^*(E^{dc}) = h - 2 G \varepsilon_0 \varepsilon_r (E^{dc}) E^{dc}, \quad (7)$$

$$\tilde{c}(E^{dc}) = c + M (\varepsilon_0 \varepsilon_r (E^{dc}) E^{dc})^2. \quad (8)$$

Зависимость модуля упругости от напряженности электрического поля была получена экспериментально в [11] в виде $\tilde{c} = c(T) + a(T) E^2$, что аналогично (8) для фиксированной температуры T .

3. Параметры акустических резонаторов в условиях наведенного пьезоэффекта

Решение уравнений (5) и (6) с соответствующими условиями на границах акустического слоя позволяет найти волну деформации, которая характеризуется вол-

новым числом $k = \omega/V_{ac}$, где ω — круговая частота, V_{ac} — акустическая скорость,

$$V_{ac} = \sqrt{\frac{c + M \cdot (\epsilon_0 \epsilon_r (E^{dc}) E^{dc})^2}{\rho}}. \quad (9)$$

Здесь ρ — объемная плотность материала. В выражении (9) для акустической скорости, которая определяет резонансную длину акустической волны, присутствует напряженность постоянного электрического поля E^{dc} и относительная диэлектрическая проницаемость ϵ_r , зависящая от напряженности электрического поля, что и определяет возможность изменения акустической длины волны приложенным полем.

Для нулевых граничных условий входной электрический импеданс акустического резонатора определяется выражением

$$Z_{eq} = \frac{1}{i\omega C} \left(1 - K^2 \frac{\operatorname{tg} kl}{kl} \right), \quad (10)$$

где C — емкость конденсатора, образованного структурой ОАР, $2l$ — толщина акустического слоя, K — коэффициент электромеханической связи

$$K^2 = 2\epsilon_0 \epsilon_r (E^{dc}) h^{*2} \frac{1}{\tilde{c}}. \quad (11)$$

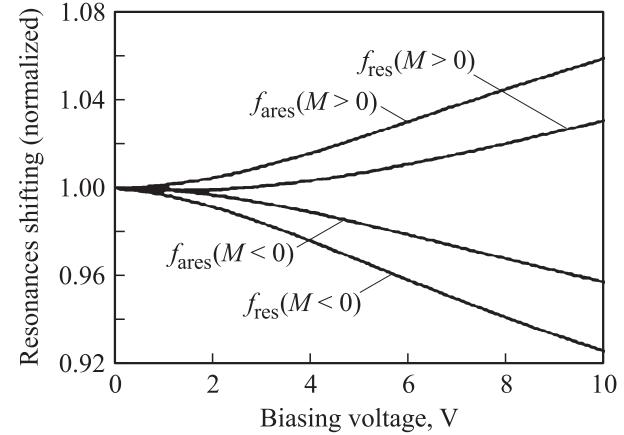
Коэффициент электромеханической связи является существенной функцией напряженности электрического поля. Как было показано в [8], коэффициент электромеханической связи тем больше, чем выше качество сегнетоэлектрической пленки. В соответствии с моделью диэлектрического отклика [12] зависимость коэффициента электромеханической связи от напряженности поля смещения имеет максимум.

Резонанс и антирезонанс в структуре ОАР соответствуют условиям $Z_{eq} = 0$ и $Z_{eq}^{-1} = 0$, что с учетом (10) и (11) позволяет определить частоты резонанса и антирезонанса

$$f_{res} = \frac{v_{ac}^0 \sqrt{1 + \frac{1}{c} M (\epsilon_0 \epsilon_r (E^{dc}) E^{dc})^2} (1 - \frac{4}{\pi^2} K^2 (E^{dc}))}{4l}, \quad (12)$$

$$f_{ares} = \frac{v_{ac}^0 \sqrt{1 + \frac{1}{c} M (\epsilon_0 \epsilon_r (E^{dc}) E^{dc})^2}}{4l}. \quad (13)$$

Из (12) и (13) следует, что изменение частоты антирезонанса определяется только нелинейным коэффициентом электрострикции M , в то время как частота резонанса зависит и от коэффициента электромеханической связи K . Порядок величины параметра M и его знак могут быть найдены из экспериментальных данных. Доступными являются прямые эксперименты по исследованию диэлектрической проницаемости керамических образцов титаната стронция в условиях всестороннего сжатия [13–16]. Найденное из



Относительное изменение частоты резонанса и антирезонанса ОАР в условиях наведенного пьезоэффекта для $M > 0$ и $M < 0$.

этих данных усредненное значение нелинейного коэффициента электрострикции было оценено в пределах $M \approx -3 \cdot 10^{11} \dots -7 \cdot 10^{11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$. Примем такой же порядок коэффициента M для пленки BSTO, сохранив отрицательный знак: $M \approx -10^{12} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$. Поскольку для резонатора на титанате бария экспериментально зарегистрирован уход резонансных частот в сторону более высоких частот [1], [7], в соответствии с (12) и (13) следует принять для моделирования электромеханических свойств BaTiO₃ положительный коэффициент $M \approx 10^{12} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$.

Результаты моделирования перестройки частот резонанса и антирезонанса от приложенного напряжения для пленки толщиной $2l = 0.3 \text{ mm}$ с параметрами $Q = 0.066 \text{ m}^4/\text{C}^2$, $c_{33} = 0.25 \cdot 10^{12} \text{ N/m}^2$, $h = 1.4 \cdot 10^8 \text{ V/m}$ и $|M| = 3 \cdot 10^{12} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ для положительного и отрицательного значений M представлены на рисунке. Для $M < 0$ уменьшаются частоты резонанса и антирезонанса за счет наведенного пьезоэффекта, причем частота резонанса меняется более эффективно за счет дополнительного вклада, определяемого коэффициентом связи. В случае $M > 0$ обе частоты увеличиваются при приложении постоянного электрического поля. Частота антирезонанса перестраивается более эффективно по сравнению с частотой антирезонанса, что объясняется разными знаками M и K в формуле (2) для частоты резонанса. Такое поведение соответствует экспериментальным результатам [7]. Используя нелинейный коэффициент электрострикции в качестве подгоночного параметра модели, можно достоверно описать характеристики наведенного пьезоэффекта в сегнетоэлектрических материалах уравнениями (5) и (6). Для реальных структур ОАР с ненулевыми граничными условиями следует использовать выражение для входного импеданса [17], учитывающее акустические параметры материала электродов. Такое моделирование было успешно выполнено в [9] для акустических резонаторов на пленках BaTiO₃.

и BSTO, экспериментальные характеристики которых приведены в [7].

4. Заключение

На основе модели наведенного пьезоэфекта в сегнетоэлектрическом акустическом слое получен коэффициент электромеханической связи как функция напряженности постоянного электрического поля. Найдено выражение для входного электрического импеданса акустического резонатора, позволяющее определить частоты резонанса и атирезонанса и оценить возможную их перестройку. Показано, что основным параметром при этом является коэффициент нелинейной электрострикции M . Использование коэффициента M в качестве подгоночного параметра модели позволяет адекватно описать экспериментальные характеристики ОАР, полученные для разных материалов. Необходима постановка специальных исследований нелинейной электрострикции в сегнетоэлектриках — как экспериментальных, так и теоретических (из первых принципов).

Автор выражает благодарность О.Г. Вендику, А.К. Тагантsevу, С.Ш. Геворкяну и П.А. Туральчуку за плодотворное сотрудничество.

Список литературы

- [1] W.P. Mason. Phys. Rev. **74**, 1134 (1948).
- [2] Д. Берлинкур, Д. Керран, Г. Жаффе. В кн.: Методы и приборы ультразвуковых исследований. Ч. А / Под ред. У. Мэзона. Мир, М. (1966). С. 295.
- [3] J.M. Pond, S.W. Kirchoffer, W. Chang, J.S. Horwitz, D.B. Chrisey. Integrated Ferroelectrics **22**, 317 (1998).
- [4] О.Г. Вендики, Л.Т. Тер-Мартиросян. ЖТФ **69**, 93 (1999).
- [5] S. Tapper, U. Boettger, R. Waser. Appl. Phys. Lett. **85**, 624 (2004).
- [6] S. Gevorgian, A. Vorobiev, T. Lewin. J. Appl. Phys. **99**, 124 112 (2006).
- [7] J. Berge, A. Vorobiev, W. Steichen, S. Gevorgian. IEEE Microwave Wireless Components Lett. **17**, 655 (2007).
- [8] O.G. Vendik, I.B. Vendik. J. Eur. Ceram. Soc. **27**, 2949 (2007).
- [9] I.B. Vendik, P.A. Turalchuk, O.G. Vendik, J. Berge. J. Appl. Phys. **103**, 014 107 (2008).
- [10] A. Noeth, T. Yamada, V.O. Sherman, P. Muralt, A.K. Tagantsev, N. Setter. J. Appl. Phys. **102**, 114 110 (2007).
- [11] G. Ruprecht, W.H. Winter. Phys. Rev. **155**, 1019 (1967).
- [12] O.G. Vendik, S.P. Zubko. J. Appl. Phys. **88**, 5343 (2000).
- [13] В.Я. Фрицберг. Фазовые переходы в сегнетоэлектриках. Зинатне, Рига (1971). С. 117.
- [14] G.A. Samara, A.A. Giardini. Phys. Rev. **140**, A 954 (1965).
- [15] G.A. Samara. Phys. Rev. **151**, 378 (1966).
- [16] R.P. Lowndes, A. Rastogi. J. Phys. C **6**, 932 (1973).
- [17] K.M. Lakin, G.R. Kline, K.T. McCarron. IEEE Trans. Microwave Theory Techn. **41**, 2139 (1993).